# スパッタ法で作製した多結晶 BaSi<sub>2</sub> 膜への B イオン注入による伝導型制御 Control of conduction type by B implantation into polycrystalline BaSi<sub>2</sub> films prepared by sputtering

筑波大学<sup>1</sup>,東ソー株式会社<sup>2</sup>

○佐藤 匠¹, 木戸 一輝¹, 長谷部 隼¹, 竹中 晴紀¹, 青貫 翔¹, 召田 雅実², 都甲 薫¹, 末益 崇¹ Univ. Tsukuba¹, Tosoh Corporation²

<sup>o</sup>T. Sato<sup>1</sup>, K. Kido<sup>1</sup>, H. Hasebe<sup>1</sup>, H. Takenaka<sup>1</sup>, S. Aonuki<sup>1</sup>, M. Mesuda<sup>2</sup>, K. Toko<sup>1</sup>, T. Suemasu<sup>1</sup>,

# E-mail: s2113596@s.tsukuba.ac.jp

# 【背景·目的】

本研究では新規薄膜太陽電池材料として BaSi<sub>2</sub>に注目している。BaSi<sub>2</sub> は豊富な元素から構成され、大きな光吸収係数と優れた少数キャリア特性を併せ持つため、高効率な太陽電池の実現が期待されている[1]。先行研究では、Ba 及び BaSi<sub>2</sub> ターゲットを用いた同時スパッタ法によるB-doped p-BaSi<sub>2</sub> 膜の作製が検討された。しかし、As-grownでは膜中の酸素によりn型となり、熱処理することでp型となった[2]。そのため、スパッタ膜で連続的なホール密度制御は達成できていない。一方、MBE 法でエピタキシャル成長した BaSi<sub>2</sub>膜では、成膜時のB供給と、成膜後のBのイオン注入の両方で、連続的なホール密度制御を達成している[3]。そこで本研究では、スパッタ法により作製した多結晶 undoped BaSi<sub>2</sub>膜へBのイオン注入を試み、p-BaSi<sub>2</sub>膜の作製を目指した。

#### 【実験】

FZ-n-Si(111)基板( $\rho$  > 1000  $\Omega$ cm)上にスパッタ法を用いて BaSi<sub>2</sub> 膜を 200 nm 堆積した。堆積時には基板温度を 600 °C、Ar ガス圧力を 0.5 Pa、BaSi<sub>2</sub> ターゲット(東ソー(株)製)の RF-Power を 70 W、Ba ターゲットの RF-Power を 40 W に設定した。BaSi<sub>2</sub> 膜の堆積後、酸化防止のため in situ で a-Si キャップ層を 3 nm 堆積した。その後、イオン注入装置により BF<sub>3</sub>を用いて B をイオン注入した。イオン注入時の加速電圧は 20 keV、ドーズ量は  $10^{14}$  cm<sup>-2</sup>に設定した。最後に、Ar 雰囲気下において 1000 °C のポストアニールを 1-15 分間の範囲で行った。試料の結晶性をラマン分光装置、電気特性をホール測定により評価した。

# 【結果·考察】

Fig. 1 にアニール時間(ta)を変調した各試料のラマンスペクトルを示す。全ての試料において Si 四面体由来の振動モードを検出し、BaSi2 が結晶化していることを確認した。また、アニール時間の増加に伴って Ag モードが低波数側へシフトした。本結果は B が Si に置換したことを示唆する。

Fig. 2 にキャリア密度と移動度のアニール時間依存性を示す。ポストアニールを施すことにより伝導型が p 型となった。これは高温処理によって膜中の O が Si 四面体から移動し、B が Si と置換したためと考えられる<sup>[2]</sup>。また、アニール時間の変調によりホール密度が連続的に増加した。これはアニール時間の増加に伴い、B の活性化率が増加したためと考えられる。以上より、スパッタ法による連続的な伝導型制御を初実証した。

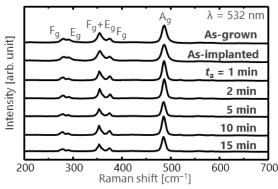


Fig. 1 Raman spectra of undoped as-grown BaSi<sub>2</sub> and B-implanted BaSi<sub>2</sub> films annealed at 1000 °C for different durations.

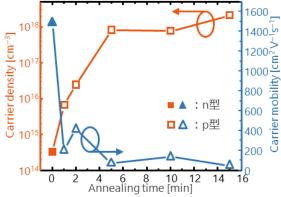


Fig. 2 Annealing duration dependences on hole concentration and mobility of B-implanted p-BaSi<sub>2</sub> films annealed at  $1000~^{\circ}\text{C}$  for 0-15~min.

- [1] T. Suemasu and N. Usami, J. Phys. D  $\mathbf{50}$ , 023001 (2017).
- [2] H. Hasebe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 62, SD1010 (2023).
- [3] S. Aonuki et al., Jpn. J. Appl. Phys. in press.